

nanoVTEP ConnectCheck Signal C

OTE-KS-NV-064-MUX-REF

Artículo 108711



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

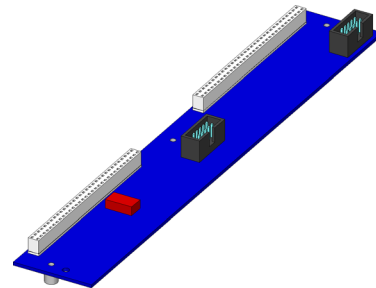
- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para todos los sistemas de prueba Keysight 307x con versión de software 9.2 o superior
- Exactitud de repetición, cobertura de pruebas y detección de errores mejoradas en comparación con la tecnología VTEP
- 2x 64 contactos, para conectar hasta 64 nanoVTEP sondas de prueba

Utilización

Las sondas de prueba nanoVTEP se utilizan para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura.

Respecto a las sondas de prueba nanoVTEP se trata de la más reciente solución de prueba para opens sin vectores de Keysight, que sustituye a las sondas de prueba VTEP. Además de la exactitud de repetición, cobertura de pruebas y detección de errores claramente mejoradas, las nuevas sondas de prueba nanoVTEP ofrecen una amplificación de hasta el 40% de las señales débiles, dado que el amplificador se encuentra situado cerca de la placa de sensor.

Las nuevas nanoVTEPs funcionan solo en combinación con los nanoVTEP MUX Boards. En una fixtura pueden utilizarse combinadas unas con otras tanto sondas de prueba nanoVTEP como también VTEP.

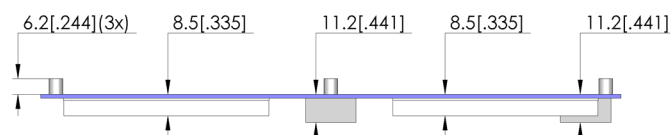
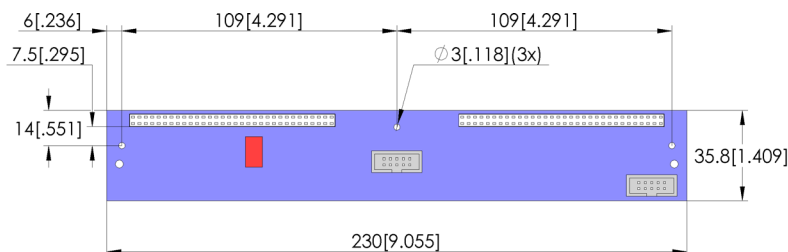


Nota:

Para realizar una ampliación de manera profesional de las sondas de prueba nanoVTEP Keysight se utilizan las instrucciones de ampliación INFO 4250.

Nota:

Las sondas de prueba nanoVTEP pueden utilizarse con seguridad en todos los sistemas de prueba Keysight 307x que cuenten con la versión de software 9.2 o superior. Si la versión de software que usted utiliza es anterior a la 9.2, por favor diríjase directamente al fabricante de sistemas de prueba Keysight.



Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTE
Tipo:	Prueba sin vectores Keysight
Modelo:	nanoVTEP Revisión de conexión señal C
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Ancho:	35,8 mm
Altura:	17,4 mm
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):	VA 2070S/L
Juegos de recambio (WS):	

Datos técnicos

Montaje:	Rosca M2.5
Cantidad de polos:	2x 64
Longitud:	230 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	230 x 35,8 x 17,4 mm



Accessories and single parts

Part no.	Designation	Version
Accessories		
114387	OTU-KS-NV-004-004-G2	nanoVTEP single probe 0.16 inches incl. nanoVTEP
114388	OTU-KS-NV-007-004-G2	nanoVTEP single probe B/C size incl. nanoVTEP
114386	OTU-KS-NV-010-010-G2	nanoVTEP single probe 0.4 inches incl. nanoVTEP
109704	OTU-KS-NV-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
109705	OTU-KS-NV-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
109706	OTU-KS-NV-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
Single parts		
114385	OTC-KS-NV-EP-ST-KS-G2	nanoVTEP (Amplifier, barrel and receptacle)
108707	OTC-KS-NV-EP	nanoVTEP amplifier
114373	OTC-KS-NV-ST-G2	nanoVTEP barrel incl. spring clip
114374	OTC-KS-NV-KS-G2	nanoVTEP receptacle
111606	OTC-KS-NV-GKS	nanoVTEP test probe
108701	OTC-KS-NV-SP-004-004	nanoVTEP single probe 0.16 inches
108702	OTC-KS-NV-SP-007-004	nanoVTEP single probe B/C size
108703	OTC-KS-NV-SP-010-010	nanoVTEP single probe 0.4 inches
108704	OTC-KS-NV-SP-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches
108705	OTC-KS-NV-SP-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches
108706	OTC-KS-NV-SP-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

